PAT-NO:

JP02002174586A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2002174586 A

TITLE:

MANUFACTURING METHOD FOR OPTICAL APERTURE

PUBN-DATE:

June 21, 2002

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SHINOHARA, YOKO

N/A

KATO, KENJI

N/A

ARAWA, TAKASHI

N/A

KASAMA, NOBUYUKI

N/A

MITSUOKA, YASUYUKI

N/A

ICHIHARA, SUSUMU

N/A

MAEDA, HIDETAKA

N/A

OMI, MANABU

N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SEIKO INSTRUMENTS INC

N/A

APPL-NO:

JP2000373311

APPL-DATE: December 7, 2000

INT-CL (IPC): G01N013/14, B82B003/00 , G01B021/00 , G12B021/06

## ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method, in which an optical aperture having a uniform aperture diameter, is formed using a simple method.

SOLUTION: The position of a conical protrusion 1 is detected by a photographing device 9 in an aperture-to-be-formed body composed of the conical protrusion 1, a stopper 2 which is arranged near the conical protrusion 1 and

whose height is nearly identical to the height of the conical protrusion 1 and a light-blocking film 3 which is formed at least on the conical protrusion 1. The aperture-to-be-formed body is positioned by a stage 10, in such a way that a pressure body 6 and the conical protrusion 1 are situated in a prescribed relative position. After that, a nearly planar plate which covers the conical protrusion 1 and the stopper 2 at least partly is pressurized toward the conical protrusion 1 by the pressure body 6, the film 3 is plastically deformed, and the optical aperture is formed nearly at the tip of the conical protrusion 1.

COPYRIGHT: (C)2002,JPO

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-174586 (P2002-174586A)

(43)公開日 平成14年6月21日(2002.6.21)

(51) Int CL'	13/14	識別記号	FI G01N 13/14	テーマコード( <del>参考</del> ) B 2F069	
B 8 2 B	3/00 21/00		B 8 2 B 3/00 G 0 1 B 21/00 G 1 2 B 1/00	A 601C	
			審查請求 未記	情求 請求項の数6 OL (全 10 頁)	
(21)出顧番号		特 <b>期</b> 2000 - 373311(P2000=3733	セ	セイコーインスツルメンツ株式会社	
(22) 出顧日		平成12年12月7日(2000.12.7)	(72)発明者 <b>権</b> 千	葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地	
			(72)発明者 加	藤 健二 業県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 株 会社エスアイアイ・アールディセンター	

(74)代理人 100096378

弁理士 坂上 正明

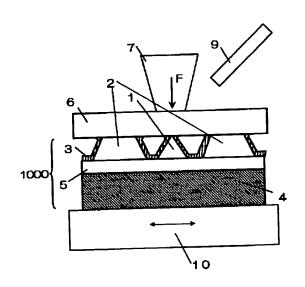
最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 光学的な関口の作製方法

#### (57)【要約】

【課題】 簡便な方法で均一な開口径を有する光学的な 開口を形成する方法を提供すること。

【解決手段】 錐状突起1と、その近傍に配置され、かつ錐状突起1と略同じ高さを有するストッパー2と、少なくとも錐状突起1上に形成された遮光膜からなる被開口形成体に、撮影装置9で錐状突起1の位置を検出し、押し込み体6と錐状突起1とが所定の相対位置となるよう、被開口形成体をステージ10で位置決めする。その後、錐状突起1とストッパー2の少なくとも一部を覆うような略平面を有する板を押し込み体6で錐状突起1に向かって加圧し、遮光膜3を塑性変形させ、錐状突起1の略先端に光学的な開口を形成することを特徴とする。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 十分な厚さを有する連光膜で覆われた微 小突起の略先端に光学的な開口を作製する方法におい 7.

1

基板上に錐状突起および前記錐状突起と略同じ高さのス トッパーを作製する工程と、

前記錐状突起を遮光膜で覆う工程と、

前記錐状突起が所定位置に位置決めされるよう前記基板 を設置する工程と、

押し込み体で少なくとも前記所定位置を加圧して、前記 10 錐状突起の略先端に光学的な開口を形成する工程とを含 むことを特徴とする光学的な開口の作製方法。

【請求項2】 前記基板を設置する工程が、前記錐状突 起の位置検出工程と、前記基板もしくは前記押し込み体 の移動工程からなることを特徴とする請求項1に記載の 光学的な開口の作製方法。

【請求項3】 前記錐状突起の位置検出工程が、前記基 板近傍の観察によるものであることを特徴とする請求項 2に記載の光学的な開口の作製方法。

【請求項4】 前記錐状突起の位置検出工程が、少なく 20 とも二方向からの観察であることを特徴とする請求項3 に記載の光学的な開口の作製方法。

【請求項5】 十分な厚さを有する遮光膜で覆われた微 小突起の略先端に光学的な開口を作製する方法におい て、

基板上に複数の錐状突起および前記錐状突起と略同じ高 さの複数のストッパーを作製する工程と、

前記錐状突起を遮光膜で覆う工程と、

押し込み体で基板の一部分ずつ加圧して、複数の前記錐 状突起の略先端に光学的な開口を形成する工程とを含む 30 ことを特徴とする光学的な開口の作製方法。

【請求項6】 十分な厚さを有する遮光膜で覆われた微 小突起の略先端に光学的な開口を作製する方法におい て、

基板上に複数の錐状突起および前記錐状突起と略同じ高 さの複数のストッパーを作製する工程と、

前記錐状突起を遮光膜で覆う工程と、

前記錐状突起より変形しやすい押し込み体で基板を加圧 して、複数の前記錐状突起の略先端に光学的な開口を一 括して形成する工程とを含むことを特徴とする光学的な 40 開口の作製方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、光学的な開口の 作製方法に関するものである。特に近視野光を照射・検 出する近視野光デバイスに用いる開口の作製方法に関す

#### [0002]

【従来の技術】試料表面においてナノメートルオーダの 微小な領域を観察するために走査型トンネル顕微鏡(S TM)や原子間力顕微鏡(AFM)に代表される走査型 プローブ顕微鏡(SPM)が用いられている。SPM は、先端が先鋭化されたプローブを試料表面に走査さ せ、プローブと試料表面との間に生じるトンネル電流や 原子間力などの相互作用を観察対象として、プローブ先 端形状に依存した分解能の像を得ることができるが、比 較的、観察する試料に対する制約が厳しい。

【0003】そこでいま、試料表面に生成される近視野 光とプローブとの間に生じる相互作用を観察対象とする ことで、試料表面の微小な領域の観察を可能にした近視 野光学顕微鏡(SNOM)が注目されている。

【0004】近視野光学顕微鏡においては、先鋭化され た光ファイバーの先端に設けられた開口から近視野光を 試料の表面に照射する。開口は、光ファイバーに導入さ れる光の波長の回折限界以下の大きさを有しており、た とえば、100mm程度の直径である。 プローブ先端に 形成された開口と試料間の距離は、SPMの技術によっ て制御され、その値は開口の大きさ以下である。このと き、試料上での近視野光のスポット径は、開口の大きさ とほぼ同じである。したがって、試料表面に照射する近 視野光を走査することで、微小領域における試料の光学 物性の観測を可能としている。

【0005】顕微鏡としての利用だけでなく、光ファイ バープローブを通して試料に向けて比較的強度の大きな 光を導入させることにより、光ファイバープローブの開 口にエネルギー密度の高い近視野光を生成し、その近視 野光によって試料表面の構造または物性を局所的に変更 させる高密度な光メモリ記録としての応用も可能であ る。強度の大きな近視野光を得るために、プローブ先端 の先端角を大きくすることが試みられている。

【0006】これら近視野光を利用したデバイスにおい て、開口の形成が最も重要である。開口の作製方法の一 つとして、特許公報平5-21201に開示されている 方法が知られている。特許公報平5-21201の開口 作製方法は、開口を形成するための試料として、先鋭化 した光波ガイドに遮光膜を堆積したものを用いている。 開口の作製方法は、遮光膜付きの先鋭化した光波ガイド を圧電アクチュエータによって良好に制御された非常に 小さな押しつけ量で硬い平板に押しつけることによっ て、先端の遮光膜を塑性変形させている。

【0007】また、開口の形成方法として、特開平11 -265520に開示されている方法がある。特開平1 1-265520の開口の作製方法において、開口を形 成する対象は、平板上に集束イオンビーム(FIB)に よって形成された突起先端である。開口の形成方法は、 突起先端の遮光膜に、側面からFIBを照射し、突起先 端の進光膜を除去することによって行っている。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、特許公 50 報平5-21201の方法によれば、光波ガイドー本ず

つしか開口を形成する事ができない。また、特許公報平 5-21201の方法によれば、移動分解能が数nmの 圧電アクチュエータによって押し込み量を制御する必要 があるため、開口形成装置をその他の装置や空気などの 振動による影響が少ない環境におかなくてはならない。 また、光伝機体ロッドが平板に対して垂直に当たるよう に調整する時間がかかってしまう。また、移動量の小さ な圧電アクチュエータの他に、移動量の大きな機械的並 進台が必要となる。さらに、移動分解能が小さな圧電ア クチュエータを用いて、押し込み量を制御する際に、制 御装置が必要であり、かつ、制御して開口を形成するた めには数分の時間がかかる。したがって、開口作製のた めに、高電圧電源やフィードバック回路などの大がかり な装置が必要となる。また、開口形成にかかるコストが 高くなる問題があった。

【0009】また、特開平11-265520の方法に よれば、加工対象は平板上の突起であるが、FIBを用 いて開口を形成しているため、一つの開口の形成にかか る時間が10分程度と長い。 また、FIBを用いるため に、試料を真空中におかなければならない。従って、開 20 口作製にかかる作製コストが高くなる問題があった。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記の問題に 鑑みてなされたものであり、本発明の光学的な開口の作 製方法は、十分な厚さを有する遮光膜で覆われた微小突 起の略先端に光学的な開口を作製する方法において、基 板上に錐状突起および前記錐状突起と略同じ高さのスト ッパーを作製する工程と、前記錐状突起を遮光膜で覆う 工程と、前記錐状突起が所定位置に位置決めされるよう 前記基板を設置する工程と、押し込み体で少なくとも前 30 記所定位置を加圧して、前記錐状突起の略先端に光学的 な開口を形成する工程とを含むものである。

【0011】また、本発明の光学的な開口の作製方法 は、前記基板を設置する工程が、前記錐状突起の位置検 出工程と、前記基板もしくは前記押し込み体の移動工程 からなるものである。

【0012】また、本発明の光学的な開口の作製方法 は、前記錐状突起の位置検出工程が、前記基板近傍の観 察によるものである。

【0013】したがって、本発明の光学的な開口の作製 40 方法によれば、錐状突起と略同じ高さを有するストッパ ーによって、押し込み体の変位が制御されるため、押し 込み体で加圧するだけで簡単に光学的な開口を作製する 事ができる。また、真空中、液中、大気中など様々な環 境下で開口を作製することができる。また、光学的な開 口を作製する際に特別な制御装置を必要としないため、 光学的な開口を作製するための装置を単純化する事がで きる。また、所定の力を与える時間を非常に短くするこ とが容易であり、開口作製にかかる時間を短くすること ができるため、開口作製にかかるコストを低くすること 50 なる。なお、ワーク1000において、透明層5は、必

ができる。また、押し込み体が加圧する位置を設定する ことで、遮光膜の変形量を精度よく制御できるため、開 口サイズを高精度に作製することができる。

【0014】また、本発明の光学的な開口の作製方法 は、前記錐状突起の位置検出工程が、少なくとも二方向 からの観察であるものである。

【0015】 したがって、押し込み体で加圧する際に、 一方向からの観察では錐状突起が押し込み体で隠れて観 察できなくなるという問題を、少なくとも二方向からの 10 観察で回避でき、高精度に錐状突起の位置検出が行え、 開口サイズをより高精度に作製することができる。

【0016】また、本発明の光学的な開口の作製方法 は、十分な厚さを有する遮光膜で覆われた微小突起の略 先端に光学的な開口を作製する方法において、基板上に 複数の錐状突起および前記錐状突起と略同じ高さの複数 のストッパーを作製する工程と、前記錐状突起を遮光膜 で覆う工程と、押し込み体で基板の一部分ずつ加圧し て、複数の前記錐状突起の略先端に光学的な開口を形成 する工程とを含むものである。

【0017】したがって、基板の一部分のみを加圧する ため、基板上での加圧力分布範囲が小さくでき、個々の 錐状突起先端の遮光膜に対して一定した加圧力がかか り、複数の錐状突起先端に同サイズの開口を作製するこ とが可能となる。

【0018】また、本発明の光学的な開口の作製方法 は、十分な厚さを有する遮光膜で覆われた微小突起の略 先端に光学的な開口を作製する方法において、基板上に 複数の錐状突起および前記錐状突起と略同じ高さの複数 のストッパーを作製する工程と、前記錐状突起を遮光膜 で覆う工程と、前記錐状突起より変形しやすい押し込み 体で基板を加圧して、複数の前記錐状突起の略先端に光 学的な開口を一括して形成する工程とを含むものであ

【0019】したがって、加圧力分布が大きくても、前 記錐状突起より変形しやすい押し込み体が基板に追従し て変形し、加圧力分布を吸収するため、個々の錐状突起 先端に一定の加圧力がかかる。そのため、複数の錐状突 起先端に一括して同サイズの開口を作製することができ る.

[0020]

【発明の実施の形態】以下、この発明につき図面を参照 しつつ詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこ の発明が限定されるものではない。

【0021】 (実施の形態1) 図1から図3は、本発明 の実施の形態1に係る開口の形成方法について説明した 図である。図1に示す、ワーク1000は、基板4上に 形成された透明層5、透明層5の上に形成された錐状の チップ1および尾根状のストッパー2、チップ1、スト ッパー2および透明層5の上に形成された遮光膜3から

ずしも必要ではなく、その場合、遮光膜3は、チップ1、ストッパー2および基板4上に形成される。また、遮光膜3は、チップ1にだけ堆積されていてもよい。 【0022】チップ1の高さH1は、数mm以下であり、ストッパー2の高さH2は、数mm以下である。高さH1と高さH2の差は、1000nm以下である。チップ1とストッパー2の間隔は、数mm以下である。また、遮光膜3の厚さは、遮光膜3の材質によって異なるが、数10nmから数100nmである。

【0023】チップ1、ストッパー2および透明層5は、二酸化ケイ素やダイヤモンドなどの可視光領域において透過率の高い誘電体や、ジンクセレンやシリコンなどの赤外光領域において透過率の高い誘電体や、フッ化マグネシウムやフッ化カルシウムなどの紫外光領域において透過率の高い材料を用いる。また、チップ1の材料は、開口を通過する光の波長帯において少しでもチップ1を透過する材料であれば用いることができる。また、チップ1、ストッパー2および透明層5は、同一の材料で構成されても良いし、別々の材料で構成されても良い。遮光膜3は、たとえば、アルミニウム、クロム、金、白金、銀、銅、チタン、タングステン、ニッケル、コバルトなどの金属や、それらの合金を用いる。

【0024】図2は、開口を形成する方法において、チ ップ1上の連光膜3を塑性変形させている状態を示した 図である。 図1で示したワーク1000の上に、チップ 1および少なくともストッパー2の一部を覆い、かつ、 少なくともチップ1およびストッパー2側が平面、か つ、透明である板6を載せ、板6の上に押し込み用具7 を載せる。このとき、押し込み用具7を載せる位置は、 撮影装置9からの画像によりチップ1の位置を認識し、 チップ1の真上に押し込み用具7が載るようにステージ 10で基板4を位置決めする。そして、押し込み用具7 はチップ1の中心軸方向に力Fを加えるため、板6がチ ップ1に向かって移動する。チップ1と板6との接触面 積に比べて、ストッパー2と板6との接触面積は、数百 ~数万倍も大きい。したがって、与えられた力Fは、ス トッパー2によって分散され、結果として板6の移動量 は小さくなる。板6の移動量が小さいため、遮光膜3が 受ける塑性変形量は非常に小さい。 また、 チップ 1 およ びストッパー2は、非常に小さな弾性変形を受けるのみ である。板6が、遮光膜よりも硬く、チップ1およびス トッパー2よりも柔らかい材料である場合、チップ1お よびストッパー2が受ける力は板6に吸収されるため、 板6の移動量がより小さくなり、遮光膜3の塑性変形量 を小さくすることが容易となる。さらに、押し込み用具 7に対して基板4を位置決めするため、押し込み用具7 が板6を加圧する領域はチップ1の真上となる。このた め、板6の移動量を高精度に制御でき、そして遮光膜3 の塑性変形量も高精度に管理できる。

【0025】図3は、カFを加えた後に、板6および押 50 以上である。

し込み用具7を取り除いた状態を示した図である。 遮光 膜3の塑性変形量が非常に小さく、チップ1およびストッパー2が弾性変形領域でのみ変形するため、チップ1 の先端に開口8が形成される。開口8の大きさは、数 n mからチップ1を通過する光の波長の回折限界程度の大きさである。 開口8に光を導入するために、基板4をチップ1の形成面と反対側からエッチングすることによって透明体5またはチップ1の少なくとも一部を露出させ

て、開口8への光の導入口を形成する。また、基板4を 10 透明材料103で構成することによって、光の導入口を 形成する工程を省くことができる。

【0026】以上説明したように、本発明の開口作製方法によれば、ストッパー2および押し込み用具7の加圧力制御で板6の移動量を良好に制御することができ、かつ、板6の移動量を非常に小さくできるため、大きさが均一で小さな開口8をチップ1先端に容易に作製することができる。また、基板側から光を照射して、開口8から近視野光を発生させることができる。

【0027】次に、ワーク1000の製造方法を図4か 6図6を用いて説明する。図4は、基板材料104上に 透明材料103を形成したのち、チップ用マスク101 およびストッパー用マスク102を形成した状態を示している。図4(a)は上面図を示しており、図4(b)は、図4(a)のA-A'で示す位置における断面図を示している。透明材料103は、気相化学堆積法(CVD)やスピンコートによって基板材料104上に形成する。また、透明材料103は、固相接合や接着などの方法によっても基板材料104上に形成することができる。次に、透明材料103上にフォトリソグラフィ工程 0102を形成する。チップ用マスク101とストッパー用マスク102を形成する。チップ用マスク101とストッパー用マスク102は、同時に形成しても良いし、別々に形成しても良い。

【0028】チップ用マスク101およびストッパー用マスク102は、透明材料103の材質と次工程で用いるエッチャントによるが、フォトレジストや窒化膜などを用いる。透明材料103は、二酸化ケイ素やダイヤモンドなどの可視光領域において透過率の高い誘電体や、ジンクセレンやシリコンなどの赤外光領域において透過率の高い誘電体や、フッ化マグネシウムやフッ化カルシウムなどの紫外光領域において透過率の高い材料を用いる。

【0029】チップ用マスク101の直径は、たとえば数mm以下である。ストッパー用マスク102の幅W1は、たとえば、チップ用マスク101の直径と同じかそれよりも数10nm~数μmだけ小さい。また、ストッパー用マスク102の幅W1は、チップ用マスク101の直径よりも数10nm~数μmだけ大きくてもよい。また、ストッパー用マスク102の長さは、数10μm以上である。

【0030】図5は、チップ1およびストッパー2を形 成した状態を示している。 図5(a)は上面図であり、 図5 (b) は、図5 (a) のA-A'で示す位置の断面 図である。チップ用マスク101およびストッパー用マ スク102を形成した後、ウエットエッチングによる等 方性エッチングによってチップ1およびストッパー2を 形成する。透明材料103の厚さとチップ1およびスト ッパー2の高さの関係を調整することによって、図1に 示す透明層5が形成されたり、形成されなかったりす る。チップ1*の*先端半径は、数nmから数100nmで 10 ある。この後、選光膜をスパッタや真空蒸着などの方法 で堆積する事によって、図1に示すワーク1000を形 成する事ができる。 また、 遮光膜 3をチップ 1 にだけ堆 積する場合、遮光膜3の堆積工程において、チップ1上 に遮光膜が堆積するような形状を有するメタルマスクを 乗せてスパッタや真空蒸着などを行う。 また、ワーク 1 000のチップが形成された面の全面に遮光膜3を堆積 した後、チップ1にだけ遮光膜3が残るようなフォトリ ソグラフィ工程を用いても、チップ1上にだけ遮光膜3 を形成する事ができる。

【0031】図7および図8は、上記で説明したワーク 1000の作製方法におけるチップ1とストッパー2の 高さの関係を説明する図である。なお、以下では、チッ プ用マスク101の直径が、ストッパー用マスク102 の幅よりも小さい場合について説明する。 図7は、図5 (a)で説明した工程において、チップ1とストッパー 2だけを示した図であり、図8は、図7中B-B'で示 す位置のチップ1と、図7中C−C'で示す位置のスト ッパー2の断面図である。

【0032】図8 (a)は、チップ1がちょうど形成さ 30 れた状態を示した図である。ストッパー用マスク102 の幅は、チップ用マスク101の直径よりも大きいた め、図8 (a) の状態では、ストッパー2の上面には、 平らな部分が残り、この平らな部分上にストッパー用マ スク102が残っている。 しかしながら、 チップ用マス ク101は、チップ1との接触面積が非常に小さくなる ため、はずれてしまう。 図8 (a) の状態では、チップ 1の高さH11とストッパー2の高さH22は、同じで

【0033】図8 (b) は、図8 (a) の状態からさら にエッチングを進め、ストッパー2上面の平らな部分が ちょうどなくなった状態を示している。 図8(a)の状 態からさらにエッチングを行うと、チップ用マスク10 1が無いチップ1の高さH111は、徐々に低くなって いく。一方、ストッパー用マスクが残っているストッパ ー2の高さH222は、H22と同じままである。 スト ッパー2の上面の平らな部分の幅は、徐々に狭くなり、 断面形状は図8(b)に示すように、三角形になる。 こ のときのチップ1とストッパー2の高さの差ΔHは、チ ップ用マスク101の直径とストッパー用マスク102 50 製する。このように二方向からの観察を行うことで、チ

の幅の差、および、チップ1とストッパー2の先端角に よって異なるが、おおよそ1000nm以下程度であ

【0034】図8 (c)は、図8 (b) の状態からさら にエッチングを進めた状態を示している。 チップ1の高 さH1111は、高さH111よりも低くなる。同様 に、ストッパーH2222の高さも、高さH222より も小さくなる。しかし、高さH1111と高さH222 2の減少量は、同じであるため、チップ1とストッパー 2の高さの差∆Hは、変化しない。なお、ストッパー用 マスク102の幅が、チップ用マスク101よりも小さ い場合は、チップ1とストッパー2の高さの関係が逆に なるだけである。また、チップ用マスク101とストッ パー用マスク102が等しい場合は、チップ1とストッ パー2の高さが等しくなる。

【0035】本発明のワーク1000の作製方法によれ ば、フォトリソグラフィ工程によってチップ1とストッ パー2の高さの差ΔΗを良好に制御することができる。 したがって、図1から図3で説明した開口作製方法にお 20 いて、押し込み用具7の変位量を良好に制御することが できる。

【0036】図6および図9は、撮影装置9の観察方向 と開口作製装置構成について示す。 図2に示した撮影装 置9の観察方向では、基板4の上下動も左右方向のずれ と認識する。これを回避するには、チップ1の真上から の観察が有効だが、押し込み用具7でチップ1が死角と なってしまうので、結果的に基板4の上下位置を厳密に 管理する必要がある。

【0037】そこで、図6のように、押し込み用具7を 回転移動させることで、撮影装置9がチップ1の真上か ら観察できる方法がある。この場合、基板4上に透明層 5、その上にチップ1およびストッパー2を設け、少な くともチップ1の上に遮光膜3を設けてある。この時、 撮影装置9の画像からチップ1の位置を求め、 開口作製 時に押し込み用具7の所定位置にチップ1がくるよう、 ステージ10で基板4を位置決めする。 なお、板6をチ ップ1と押し込み体7との間に設けた構成でも、同様に 機能することが可能である。これにより、基板4の上下 動を管理しなくても、高い精度で開口を作製することが できる。

【0038】また、図9のように、撮影装置91および 92を用意して、別々の方向からチップ1の位置を検出 することも可能である。図6と同様に、基板4上に透明 層5、その上にチップ1およびストッパー2を設け、少 なくともチップ1の上に連光膜3を設ける。撮影装置9 1および92でチップ1の位置を求め、チップ1とスト ッパー2の上に板6を載せる。 チップ1の真上に押し込 み用具7の先端がくるよう、押し込み用具7をステージ 10で位置決めし、押し込み用具7で加圧して開口を作 ップ1の位置を三次元で認識でき、加圧位置に対して押し込み体7を正確に位置決めできる。なお、チップ1が小さい場合、チップ1自体で位置を認識するのではなく、ストッパー2、もしくは基板上に設けた位置決めマーク、基板のオリフラ、基板を保持するホルダーに設けた位置決めマーク等の位置からチップ1の位置を算出する方法も可能である。また、基準位置を撮影装置9から求め、チップ1の位置へ押し込み用具7を移動、開口作製、次のチップ1の位置へ押し込み用具7を移動、開口作製、というように一つの基準位置検出で連続して複数の開口を作製することも可能である。また、上記の実施例において、板6の有無に関係なく、開口作製は可能である。これにより、基板4の上下位置を厳密に管理せずとも、開口サイズを精度よく作製することが可能とな

【0039】以上説明したように、本発明の実施の形態 1によれば、チップ1とストッパー2の高さを良好に制 御することができ、かつ、ストッパー2を設けることに よって板6の変位量を小さくすることができるため、分 20 解能の高いアクチュエータを用いなくても、大きさが均 一で微小な開口8をチップ1先端に形成する事が容易で ある。また、チップ1とストッパー2の高さが良好に制 御されるため、 閉口8の作製歩留まりが向上した。 ま た、本発明の実施の形態1で説明したワーク1000 は、フォトリソグラフィ工程によって作製可能なため、 ウエハなどの大きな面積を有する試料に、複数個作製す ることが可能であり、押し込み用具7を所定の力で加圧 することによって複数個作製されたワーク1000それ ぞれに対して均一な開口径の開口8を形成する事ができ る。また、押し込み用具7の加圧位置をチップ1に対し て位置決めするため、開口サイズを精度よく作製するこ とが可能である。 また、 単純に押し込み用具 7をチップ 1およびストッパー2に向かって加圧するだけで開口8 が形成されるため、開口作製にかかる時間は数秒から数 10秒と非常に短い。また、本発明の実施の形態1によ れば、加工雰囲気を問わない。従って、大気中で加工す る事が可能でありすぐに光学顕微鏡などで加工状態を観 察できる。また、走査型電子顕微鏡中で加工することに よって、光学顕微鏡よりも高い分解能で加工状態を観察 することも可能である。また、液体中で加工することに よって、液体がダンパーの役目をするため、より制御性 の向上した加工条件が得られる。

【0040】また、ワーク1000が複数個作製された 試料に対して、位置決めされた押し込み用具7による力 Fを一括で加えることによって、開口径のそろった開口 8を一度に複数個作製する事も可能である。一括で加工 する場合、ウエハー枚あたりのワーク1000の数にも よるが、開口1個あたりの加工時間は、数百ミリ秒以下 と非常に短くなる。 【0041】(実施の形態2)図10および図11に本発明の実施の形態2に係る光学的開口を持つ錐状突起の作製方法を示す。図10に示すワーク2001は、基板4上に形成された透明層5、透明層5の上に形成されたチップ1およびストッパー2、チップ1およびストッパー2の上に形成された選光膜3からなる。チップ1およびストッパー2の上にローラー状の押し込み用具7が回転支持されている。なお、チップ1およびストッパー2の形状および配置などは実施の形態1と同一であるので説明を省略する。また、押し込み用具7はステンレス製であり、チップ1側の面が平面でなくとも、微細な凹凸な面でも遮光膜3より変形しにくい材料であれば構成可能である。押し込み用具7の加圧力は数十グラムであるが、遮光膜3や板6の剛性、開口の設計寸法により、所定の重さに設定する。

【0042】押し込み体7は回転しながら基板4の上を移動するため、基板4の一部分を順々に加圧することになる。この加圧により遮光膜3が塑性変形して、チップ1の先端に開口が作製される。押し込み体7の加圧位置の移動にしたがい、複数のチップ1先端に開口が次々に形成される。これにより、押し込み体7は基板4の限定された領域のみを加圧するため、基板4全体を一括して加圧するより加圧力の分布が小さくなり、開口サイズを安定して作製することができる。また、小さい面積を加圧するため、押し込み体7の加圧力を小さくできる。

【0043】また、図11に示すように、基板4全体を 一括して加圧する場合、押し込み体7を変形しやすい構 造にして加圧力の分布を小さくする方法がある。ワーク 2002は、基板4に設けられたチップ1およびストッ パー2、遮光膜3、透明層5であり、前記ワーク200 1と同様である。チップ1およびストッパー2の上に変 形しやすい構造の押し込み用具7で加圧する。加圧する と、押し込み体7は基板4に沿って変形し、開口を作製 する部分の押し込み体7表面は、対向する基板4表面と 平行になるよう移動する。このとき、押し込み体7の移 動により遮光膜3が塑性変形してチップ1先端に開口が 作製される。したがって、押し込み用具7で複数のチッ プ1を一括して加圧する際、加圧力の分布を押し込み体 7が変形することで吸収するため、複数のチップ1の先 端に同一サイズの開口を精度よく作製することができ る。また、一括して複数の開口を作製できるため、短時 間で大量製造でき、作製コストを低くできる。

【0044】したがって、ワーク2001での開口作製では、基板4の一部分のみを押し込み用具7で加圧するため、加圧力の分布および加圧力を小さくでき、開口を精度よく作製する事が可能となる。さらに、加圧位置は移動することができるため、高速かつ大量に開口を作製することができる。またワーク2002での開口作製では、変形しやすい押し込み体7を用いて開口を作製することで、加圧力に分布があっても、精度の高い開口を作

製することができ、歩留まりも向上する。また、一括し て複数の開口を作製できることから、高速かつ大量に開 口を作製でき、製造コストを低くできる。

11

#### [0045]

【発明の効果】チップ1とストッパー2の高さ、およ び、押し込み用具7の加圧力を設定する事によって、分 解能の高いアクチュエータを用いなくても、簡単に開口 8を形成する事ができる。 また、 チップ 1 とストッパー 2の高さが良好に制御されるため、 開口8の作製歩留ま りが向上した。また、本発明の実施の形態1で説明した 10 ワーク1000は、フォトリソグラフィ工程によって作 製可能なため、ウエハなどの大きな面積を有する試料 に、複数個作製することが可能であり、押し込む力Fを 容易に一定にできるので、複数個作製されたワーク10 00それぞれに対して均一な開口径の開口8を形成する 事ができる。また、力Fの大きさを変えることが非常に 簡単なため、複数個作製されたワーク1000に対して 個別に開口径の異なる開口8を形成する事が可能であ る。また、押し込み用具7で加圧するだけで開口が形成 されるため、開口作製にかかる時間は数10秒以下と非 20 常に短い。また、本発明の実施の形態1によれば、加工 雰囲気を問わない。従って、大気中で加工する事が可能 でありすぐに光学顕微鏡などで加工状態を観察できる。 また、走査型電子顕微鏡中で加工することによって、光 学顕微鏡よりも高い分解能で加工状態を観察することも 可能である。また、液体中で加工することによって、液 体がダンバーの役目をするため、より制御性の向上した 加工条件が得られる。また、撮影装置9でチップ1の位 置を簡易に求めることができ、さらに押し込み体7とチ ップ1との相対位置をステージ10で管理することがで 30 4 基板 きるため、開口サイズを一定かつ精度良く作製すること が可能となる。また、複数の撮影装置を用いることで、 チップ1と押し込み体7との相対位置関係を正確に求め ることができるため、開口サイズをより精度よく作製す ることができる。また、ワーク1000が複数個作製さ れた試料に対して、押し込み用具7で加圧することによ って、開口径のそろった開口8を一度に複数個作製する 事も可能である。一括で加工する場合、ウエハー枚あた りのワーク1000の数にもよるが、閉口1個あたりの 加工時間は、数百ミリ秒以下と非常に短くなる。

【0046】また、本発明の実施の形態2によれば、基 板4の一部分のみを押し込み用具7で加圧するため、加 圧力の分布および加圧力を小さくでき、開口を精度よく 作製する事が可能となる。さらに、加圧位置は移動する ことができるため、高速かつ大量に開口を作製すること ができる。 また、 変形しやすい押し込み体7を用いて開 口を作製することで、加圧力に分布があっても、精度の 高い開口を作製することができ、歩留まりも向上する。

また、一括して複数の開口を作製できることから、高速 かつ大量に開口を作製でき、製造コストを低くできる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態1に係る開口の作製方法に ついて説明した図である。

【図2】本発明の実施の形態1に係る開口の作製方法に ついて説明した図である。

【図3】本発明の実施の形態1に係る開口の作製方法に ついて説明した図である。

【図4】ワーク1000の製造方法について説明した図

【図5】ワーク1000の製造方法について説明した図 である。

【図6】本発明の実施の形態1に係る開口の作製方法に ついて説明した図である。

【図7】ワーク1000の作製方法におけるチップ1と ストッパー2の高さの関係を説明する図である。

【図8】ワーク1000の作製方法におけるチップ1と ストッパー2の高さの関係を説明する図である。

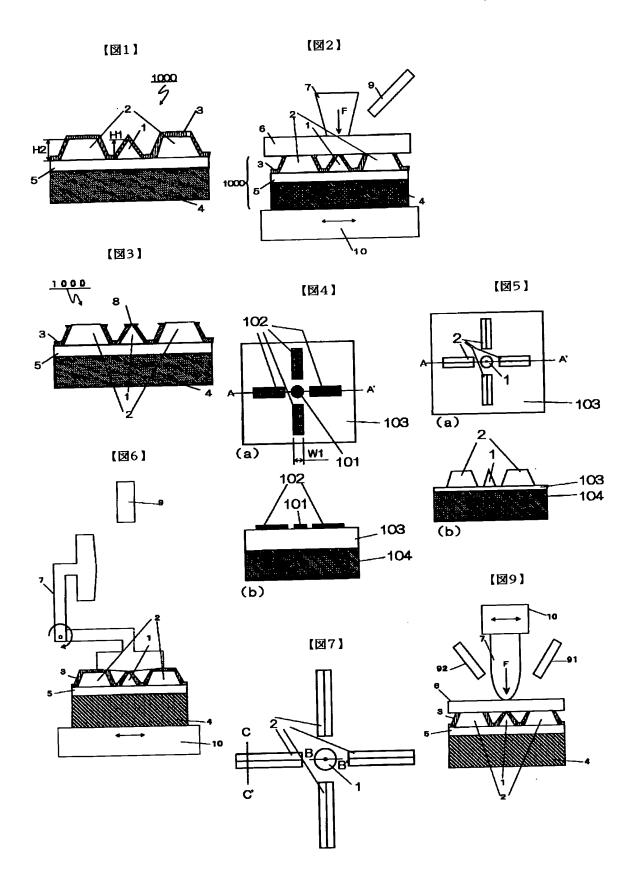
【図9】本発明の実施の形態1に係る開口の作製方法に ついて説明した図である。

【図10】本発明の実施の形態2に係る開口の作製方法 について説明した図である。

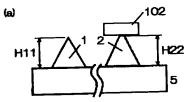
【図11】本発明の実施の形態2に係る開口の作製方法 について説明した図である。

#### 【符号の説明】

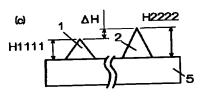
- 1 チップ
- 2 ストッパー
- 3 進光膜
- - 5 透明層
  - 6 板
  - 7 押し込み用具
  - 8 開口
  - 9 撮影装置
  - 10 ステージ
  - 91 撮影装置
  - 92 撮影装置
- 101 チップ用マスク
- 102 ストッパー用マスク
  - 103 透明材料
  - 104 基板材料
  - 1000 ワーク
  - 2001 ワーク
  - 2002 ワーク
  - F 力
  - H1 チップの高さ
  - H2 ストッパーの高さ



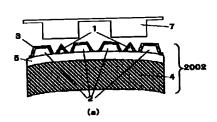
【図8】

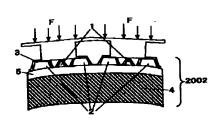




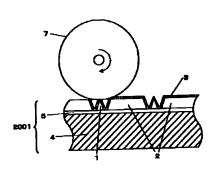


【図11】





【図10】



### フロントページの続き

## (72)発明者 新輪 隆

千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 株式会社エスアイアイ・アールディセンター内

## (72)発明者 笠間 宣行

千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 株式会社エスアイアイ・アールディセンター内

## (72) 発明者 光岡 靖幸

千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 株式会社エスアイアイ・アールディセンター内

## (72)発明者 市原 進

千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 株式会社エスアイアイ・アールディセンター内

(10)

特開2002-174586

(72)発明者 前田 英孝

千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 株式会社エスアイアイ・アールディセンター内

(72) 発明者 大海 学

千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 株 式会社エスアイアイ・アールディセンター

内

Fターム(参考) 2F069 AA01 GG04 GG07 GG58 HH30